

Guia docent

220071 - CTMA - Tècniques de Caracterització d'Aliatges Metàl·liques

Última modificació: 02/04/2024

Unitat responsable: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa

Unitat que imparteix: 702 - CEM - Departament de Ciència i Enginyeria de Materials.

Titulació:

- GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL (Pla 2009). (Assignatura optativa).
- GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
- GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
- GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
- GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
- GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2010). (Assignatura optativa).
- GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES AEROESPACIALS (Pla 2010). (Assignatura optativa).
- GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS (Pla 2010). (Assignatura optativa).
- GRAU EN ENGINYERIA EN VEHICLES AEROESPACIALS (Pla 2010). (Assignatura optativa).

Curs: 2024

Crèdits ECTS: 3.0

Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: MARIA NURIA SALAN BALLESTEROS

Altres:

METODOLOGIES DOCENTS

Veure versió en anglès

OBJECTIUS D'APRENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Veure versió en anglès

HORES TOTALES DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus	Hores	Percentatge
Hores aprenentatge autònom	45,0	60.00
Hores grup gran	30,0	40.00

Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS

títol català

Descripció:

contingut català

Dedicació: 25h

Grup gran/Teoria: 10h

Aprenentatge autònom: 15h

títol català

Descripció:

contingut català

Dedicació: 25h

Grup gran/Teoria: 10h

Aprenentatge autònom: 15h

títol català

Descripció:

contingut català

Dedicació: 25h

Grup gran/Teoria: 10h

Aprenentatge autònom: 15h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Veure versió en anglès

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:

- Heimendahl, Manfred von. Electron microscopy of materials : an introduction. New York: Academic Press, 1980. ISBN 0127251502.
- Eaton, Peter Jonathan; West, Paul. Atomic force microscopy. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 9780199570454.
- Beeston, B. E. P. Electron diffraction and optical diffraction techniques. Amsterdam: North-Holland, 1972. ISBN 0720442532.
- Bermúdez Polonio, Joaquín. Métodos de difracción de rayos X : principios y aplicaciones. Madrid: Pirámide, cop. 1981. ISBN 8436801806.

Complementària:

- Cullity, B.D.; Stock, S. R. Elements of X-ray diffraction. 3rd ed. Essex: Pearson, cop. 2014. ISBN 9781292040547.
- Dieter, G. E.; Schmidt, L. C. Engineering design. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2021. ISBN 9781260575279.
- Ashby, Michael F; Shercliff, Hugh; Cebon, David. Materials : engineering, science, processing and design. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014. ISBN 9780080977737.